

भारतीय मानक ब्यूरो  
(प्रयोगशाला मान्यता और प्रबंधन विभाग)

संदर्भ: एलआरएस/ ओएसएल- 7174421

10-11-2023

विषय:मै टाइप टेस्ट सेंटर सीमेन्स कलवा , नवी मुंबई, थाने , महाराष्ट्र(ओएसएल- 7174421) की मान्यता को अनुदान ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार मै टाइप टेस्ट सेंटर सीमेन्स कलवा, नवी मुंबई, थाने , महाराष्ट्र (ओएसएल- 7174421) को भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना के अंतर्गत दिनांक 08/11/2023 से 3 साल की अवधि के लिए मान्यता अनुदान दिया गया है।

प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त क्षेत्र अनुबंध - 1 में दिया गया है।

अंकिता त्रिपाठी  
वैज्ञानिक- सी (एल आर एम डी)

प्रमुख (एल आर एम डी)

प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सी एम डी -1 / सी एम डी -2 / सी एम डी -3 के लिए  
प्रमुख आई टी एस : कृपया संलग्न किए गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

**Bureau of Indian Standards**  
**(Laboratory Recognition and Management Department)**

Our Ref: LRMD/LRS/OSL-(7174421)

10-11-2023

**Subject: Grant of Recognition to M/s Type Test Center Siemens Limited kalwa, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra (OSL Code- 7174421).**

As approved by the Competent Authority M/s Type Test Center Siemens Limited Kalwa , Navi Mumbai, Thane, Maharashtra (OSL Code- 7174421) has been granted recognition for three year w.e.f. 08-11-2023 under the Laboratory Recognition Scheme of BIS.

The scope of Recognition of the lab is enclosed as **Annex-1**

Ankita Tripathi  
Scientist-C (LRMD)

Head, (LRMD)

CC: All ROs/BOs/BIS Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

Head ITS, BIS HQ-With a request to upload this circular on BIS internet

OSL CODE 7174421

CONTACT : Mr. Neelesh Kayal (Test Design Professional)

NAME TYPE TEST CENTER SIEMENS LIMITED KALWA

TELEPHONE: 9820055702

ADDRESS SIEMENS LIMITED, KALWA WORKS, THANE

FAX:

BELAPUR ROAD

E-mail

ttcslkw.in@siemens.com

Navi Mumbai 400708

REMARKS

Maharashtra

IS Number	Product	Testing Charge	Remark
1	IS 60947(Part 2): 2016	IS/IEC 60947 (Part-2):2003 - Low - Rs 494938/- Voltage Switchgear and Controlgear - Part 2 : Circuit Breakers	Exclusion : Cl.8.3.6.5 (short circuit breaking capacity at maximum short time withstand current (sequence IV)), Cl.8.3.6.2 (verification of overload releases (sequence IV)), Cl.8.3.6.3 (rated short circuit withstand current (sequence IV)), Cl.8.3.6.4 (verification of temperature-rise (sequence IV)), Cl.8.3.6.6 (verification of dielectric withstand (sequence IV)), Cl.8.3.6.7 (verification of overload releases (sequence IV)), Cl.8.3.7.1 (General), Cl.8.3.7.2 (Short-circuit at the selectivity limit current), Cl.8.3.7.3 ((stage 1) verification of temperature-rise (sequence V)), Cl.8.3.7.4 ((stage 1) verification of dielectric withstand (sequence V)), Cl.8.3.7.5 ((stage 2) verification of overload releases (sequence V)), Cl.8.3.7.6 ((stage 2) short circuit at 1.1 time the take-over current (sequence V)), Cl.8.3.7.7 ((stage 2) short circuit at rated ultimate short circuit breaking capacity (sequence V)), Cl.8.3.7.8 ((stage 2) verification of dielectric withstand (sequence V)), Cl.8.3.7.9 (Verification of Overload releases), Cl.8.3.9 (Critical d.c. load current test), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 (Electrostatic discharges), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 ("Radiated radio-frequency electromagnetic fields"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 ("Electrical fast transients/bursts"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 ("Radiated radio-frequency electromagnetic fields"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 (Surges), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1

IS Number

Product

Testing Charge

Remark

("Conducted disturbances induced by radio frequency fields"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 ("Power frequency magnetic fields"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.1 ("Voltage dips and interruptions"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.3 ("Conducted RF disturbances 150 kHz to 30 MHz"), Cl. 7.3 Annexure J Table J.3 ("Radiated RF disturbances 30 MHz to 1 000 MHz")